

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第4区分

【発行日】平成30年10月25日(2018.10.25)

【公開番号】特開2016-62638(P2016-62638A)

【公開日】平成28年4月25日(2016.4.25)

【年通号数】公開・登録公報2016-025

【出願番号】特願2015-178092(P2015-178092)

【国際特許分類】

G 11 B 5/39 (2006.01)

H 01 L 43/08 (2006.01)

【F I】

G 11 B 5/39

H 01 L 43/08 Z

【手続補正書】

【提出日】平成30年9月10日(2018.9.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

読み取器センサ積層体であって、

AFM層と、

ピンド安定化層と、

ピンド層とを備え、

前記ピンド安定化層は、前記ピンド層よりも前記AFM層に近い位置に設けられ、

前記ピンド安定化層と前記ピンド層との間に設けられ、前記ピンド安定化層および前記ピンド層と当接する非磁性スペーサ層と、

基準層とを備え、

前記ピンド安定化層と前記ピンド層との間の磁気結合は、前記ピンド安定化層と前記AFM層との間の磁気結合の50%以下である、読み取器センサ積層体。

【請求項2】

前記ピンド安定化層は、2nm以下の厚さを有する、請求項1に記載の読み取器センサ積層体。

【請求項3】

前記AFM層とピンド安定化層とは、凹設される、請求項1に記載の読み取器センサ積層体。

【請求項4】

読み取器センサ積層体であって、

AFM層と、

2nm以下の厚さを有するピンド安定化層と、

ピンド層とを備え、

前記ピンド安定化層は、前記ピンド層よりも前記AFM層に近い位置に設けられ、

前記ピンド安定化層と前記ピンド層との間に設けられ、前記ピンド安定化層および前記ピンド層と当接する非磁性スペーサ層を備え、

前記スペーサ層は、前記ピンド安定化層と前記ピンド層との間に0.15 erg/cm²の磁気結合を形成する、読み取器センサ積層体。

【請求項 5】

読み取器センサ積層体であつて、

AFM層と、

ピンド安定化層と、

ピンド層とを備え、

前記ピンド安定化層は、前記AFM層と前記ピンド層との間に設けられ、

前記ピンド安定化層と前記ピンド層との間に設けられ、前記ピンド安定化層および前記ピンド層と当接する非磁性スペーサ層を備え、

前記ピンド安定化層は、1.5nm以下の厚さを有する、読み取器センサ積層体。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0043

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0043】

上述したすべての読み取器センサ、たとえば読み取器150、200、300、400A、400Bおよびその変形、ならびに上述したセンサ積層体、たとえば積層体156、210および変形は、めつき法、スパッタリング法、真空蒸着法、エッチング法、イオンミリング法および他の堆積技術および処理技術を含むさまざまな方法の組合せによって作製されることができる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0044

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0044】

図5を参照して、フローチャートは、別のピンド層とAFM層との間に介在するピンド安定化層と非磁性スペーサ層とを有するセンサ積層体を備える読み取器センサを形成するための例示的な方法500を示す。方法は、基板上に下部シールド層を形成する動作502を含む。下部シールドと基板との間に介在材料/介在層が存在してもよいため、この動作において、下部シールドを基板上に直接形成する必要がない。動作504～512において、積層体が下部シールド上に形成される。介在材料/介在層(たとえば、シード層)が下部シールドとセンサとの間に存在してもよいため、この動作において、積層体をシールド上に直接形成する必要がない。動作504において、反強磁性層(AFM)が形成される。動作506において、5nm以下の厚さを有するピンド安定化層が、AFM層上に直接形成され、AFM層に当接する。動作508において、非磁性スペーサ層がピンド安定化層上に直接形成され、ピンド安定化層と当接する。動作510において、ピンド層が非磁性スペーサ層上に直接形成され、非磁性スペーサ層に当接する。センサ積層体の残りの層は、動作512に形成される。この動作は、基準層、自由層、1つ以上のスペーサ層またはバリア層、および他の層の形成を含む。動作504～512のいずれかの動作またはすべての動作を单一の工程(たとえば、堆積工程)に行うことができ、または動作504～512のうち任意の数の動作を組合せることができ、任意の動作の間に別の動作を介在してもよい。たとえば、凹状のAFM層と凹状のピンド安定化層とを有するセンサ積層体を形成する場合、動作504および506を单一の工程として行うことができる。その後、フロントシールドを形成する。その後、動作508、510および512を单一の工程として行うことができる。